

LED光束維持試験装置 LED-AAT

LED Luminous flux maintenance test equipment LED-AAT

It's NEW



LM-80 規格対応

特長<Features>

優れた温度性能

独自構造の均熱プレートを搭載しておりLEDの温度差を最少にします。

静止雰囲気での加熱可能

バッチ式の熱風循環炉でのテストと異なり、LEDに風を吹きかけず、静止雰囲気でのクリーンな環境でテストが可能です。

高出力LEDに対応

加熱冷却ステージの採用により高出力LEDへ対応が可能です。

軽い投資コスト

上部恒温BOX、下部制御盤の構造により部品点数を最小限に抑え、低コストを実現。

【装置概要 <Machine Outline>】

- ・LM-80試験の温度仕様に応じた、3つの温調チャンバーを搭載
- ・常温～110℃までの温度設定可能
- ・搭載ステージの均熱プレート形状を変更する事により、様々なサイズのLEDに対応可能

【一般仕様 <General Outline>】

機種名	LED-AAT
装置寸法	W:2200×L:700×H:1300 (mm) ※1
温調プレートサイズ	W:350×L:350 (mm) (1チャンバー当たり) ※1
供給電源	AC200～220V 50/60Hz 75A ※2
温調ステージ精度	LED搭載ステージ表面 0～-2℃(Δt2℃) LED周辺温度 0～-5℃(Δt5℃)※3
温度制御方式	PID制御(ヒータ)
冷却方式	冷却水(チラー)
搭載ステージサイズ	Max W:45×L:45 (mm) 最大ステージ数25個 ※1(1チャンバー当たり)
LED搭載可能ワット数	トータル 1～750W(1チャンバー当たり)
LED電源	DC 0～50V 0～2000mA 75ch

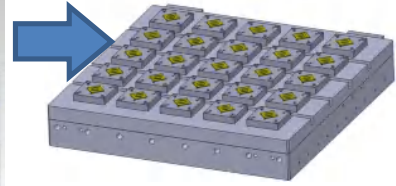
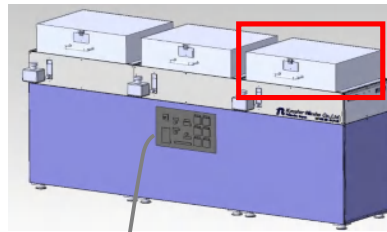
※1 サイズ変更はオーダー品で対応 ※2 LED駆動電源で変動 ※3 無負荷状況の保証精度

試験部構造 <Structure of the Testing part>

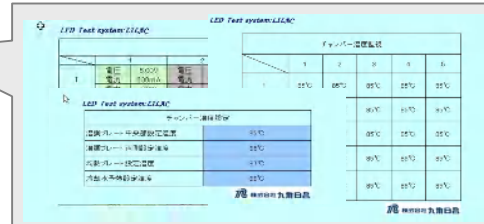
大容量のLEDが相互に熱干渉しないよう個別に搭載し、外乱の影響を受けないよう空間を構成しております。

※特許出願中!!

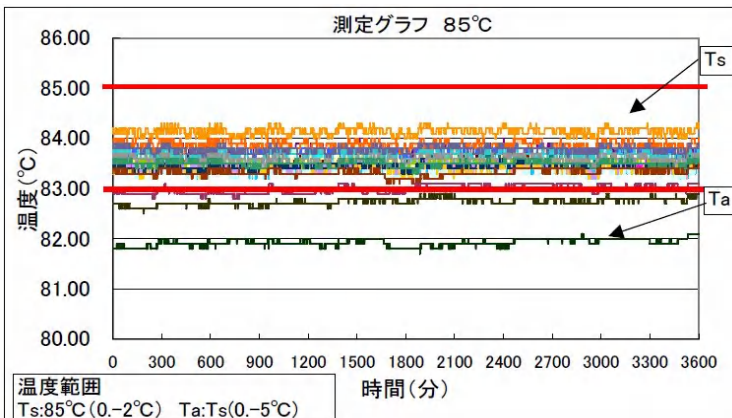
制御部にシーケンサ、LED電源を内蔵する事で温度、電流、電圧などのデータをパソコンへ記録可能です。



試験部拡大



優れた温度性能 <High in temperature performance>



《ケース温度Tsのパラツキについて》
25個LED搭載、25点温度監視、
温度設定85℃の条件にて
実測温度 83℃~85℃
偏差 Δ 2℃以内

《雰囲気温度Taのパラツキについて》
チャンバー内5点温度監視、
温度設定85℃の条件にて
実測温度 81℃~83℃
偏差 Δ 2℃以内

お問い合わせ先

株式会社九州日昌

本社

〒808-0109 福岡県北九州市若松区南二島2丁目6-7
TEL:093-701-3501 FAX:093-701-3386

東京営業所

〒173-0013 東京都板橋区氷川町1-16 氷川ビル4F
TEL:03-5944-1825 FAX:03-5944-1826

関西営業所

〒520-2153 滋賀県大津市一里山4丁目22-9-203
TEL:077-543-6551 FAX:077-543-6552

HPアドレス <http://www.kyushu-nissho.co.jp>

●仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

●Ver. 2012. 10. 25